

Type:
High Aspect Ratio Metrology
High Dense Carbon Tip



High Aspect Ratio

Type: Metrology: MC90/70 - MC60

ナノツールズ社高アスペクト比の円筒形状シリンドラティブ 2 種は 90 nm、70 nm ノード用の MC90/70 と 65 nm、58 nm ノード用の MC60 でインラインメトロロジ AFM ティップに対するソリューションです。

ティップは高密度ダイヤモンドライクカーボン (High-Dense, Diamond like Carbon) です。ヤング係数 1,000 GPa までとダイヤモンド同様のため、この M*-CNT ティップは高アスペクト比 AFM 用にスティフネスと剛性を提供します。

このカーボンナノティップ M*-CNT はティルト角度が補正され、ご要求により殆どの AFM 用にティルト角度を補正して供給できます。

技術仕様

	MC90/70	MC60	
ティップ寸法	半径 :	< 5 nm	< 5 nm
	長さ :	500 ± 100 nm	500 ± 100 nm
	直径 :	55 ± 5 nm	30 ± 5 nm
	ティルト補正 :	3 ± 1 °	3 ± 1 °
カンチレバ	厚さ 4.6 μm、長さ 160 μm、幅 45 μm 共振周波数 285 kHz、バネ定数 42 N/m		

コーティング 探針側 : なし
反射面側 : アルミレフレックスコーティング

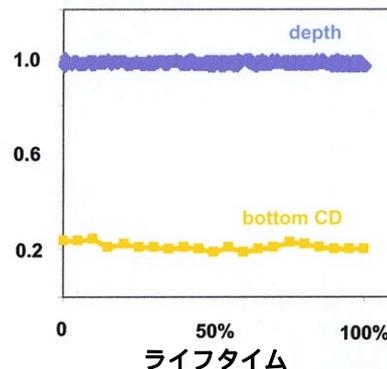
探針特性

ティップの高信頼性、全ティップの 100% 検査ほ他に、高速スキャンでも非常に磨耗が少なく、1 スキャン当りの高速スキャン速度とコストがナノツールズ社供給のプロープの主要なパラメータです。

このメトロロジティップ MC90/70 及び MC60 はエッチングデプスコントロールや 90 nm、70 nm 及び 58 nm ノード用 STI などの各種のインラインモニタリングでの選択肢です。両タイプとも半導体量産製造施設 (ファブ) でインラインモニタリング用に、そして次世代の R&D 目的にも使用されています。

詳細については info@nano-tools.com までお問い合わせ下さい。
nanotools® はナノツールズ社の登録商標です。

CD (Critical Dimensions)
[正規化]



高アスペクト比 CD サンプルの生産条件下でのスキャンデータで、深さ及び底部 CD の両結果とも全ライフタイムに亘り安定しています。

